

SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN OPTICO ELECTRICA Y LASER PULSADO

•SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN OPTICO ELECTRICA Y LASER PULSADO•

GOBIERNO ESPAÑOL. AYUDAS 2003 A PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS. Investigador responsable: IP: José Miguel López-Higuera; Centro: Fundación Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria.